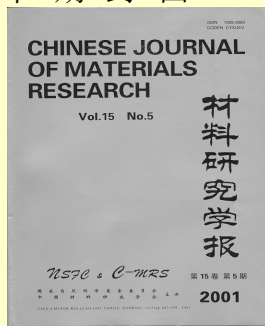


本期封面



2001年5

栏目:

DOI:

论文题目: 片层宽度对全片层TiAl合金蠕变性能的影响

作者姓名: 林建国¹, 张永刚², 陈昌麒²

工作单位: 1. 湘潭大学, 2. 北京航空航天大学

通信作者: 林建国

通信作者Email:

文章摘要: 通过不同的热处理工艺, 得到了具有相近晶粒度不同片层宽度的全片层TiAl合金组织, 并在 $T=800^{\circ}\text{C}$, $\sigma=205\text{MPa}$ 条件下, 测试了其蠕变性能, 研究了片层宽度对蠕变性能的影响规律及其机理. 研究表明, 全片层TiAl合金的初始蠕变量和最小蠕变速率随片层宽度的增加而提高. 片层界面在蠕变过程中能向基体中发射位错, 同时又能阻碍位错的发射和位错的运动.

关键词: TiAl合金; 显微组织; 蠕变性能; 片层界面

分类号:

关闭